

ЛОКАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ Vk - И U -ЦЕНТРОВ В ШГК

В.Г.Мазуренко, И.А.Вайнштейн, В.С.Кортов

Эффективность рекурсивного метода для расчета щелевых и резонансных колебаний, индуцируемых собственными и примесными дефектами в ионных кристаллах, показана в работах [1,2]. Представляет интерес использование рекурсивного метода для расчета локальных колебаний, частота которых лежит выше максимальной частоты колебаний решетки идеального кристалла. Настоящая работа посвящена расчету локальных колебаний, индуцируемых в ШГК Vk - и U -центрами, рекурсивным методом в модели жестких ионов и оболочек.

При моделировании динамики решеток ШГК с Vk -центрами принимали заряд центра равномерно распределенным между ионами галогена, т.е. по $-0.5e$. В качестве межионных потенциалов использовали неэмпирические параметры, полученные для всех ШГК в модели Гордона-Кима [3]. Данные по релаксации решетки вокруг Vk -центра в различных ШГК взяты из работы [4]. Все расчеты проводили для кластера, состоящего из ~ 1500 ионов.

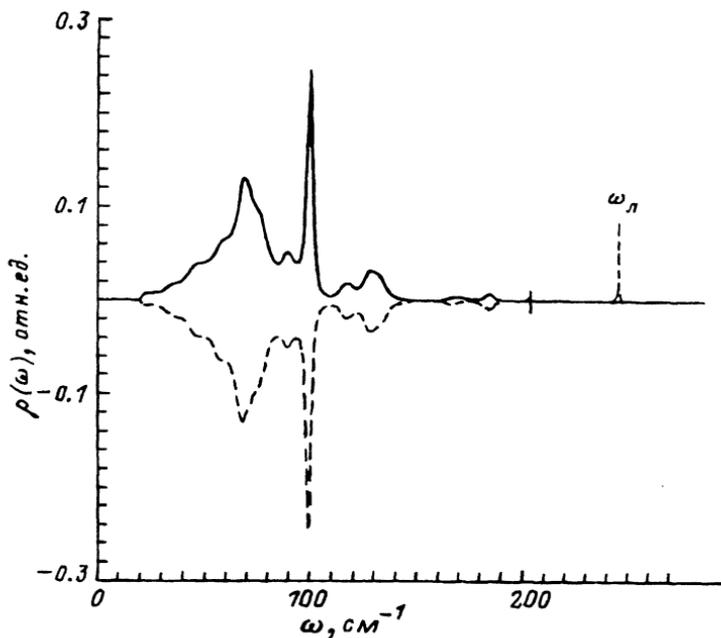
Локальную плотность состояний (ЛПС) рассчитывали по методике работы [1]. Отдельно определяли ЛПС в позиции катиона для идеального кристалла (ρ_0) и в присутствии Vk -центра (ρ), что давало возможность непосредственно выделять колебания, обусловленные наличием исследуемого дефекта.

На рисунке в качестве примера приведены ЛПС в позиции катиона в направлении x в идеальном кристалле RbCl (сплошная линия), а также приращение $\Delta\rho = \rho - \rho_0$ ЛПС (штриховая линия) при наличии в кристалле RbCl Vk -центра. Максимумы в приращении ЛПС, не совпадающие с особенностями ЛПС идеального кристалла, мы связываем с резонансными или локальными колебаниями Vk -центра. Для кристалла RbCl это локальное колебание имеет частоту 245 см^{-1} . Результаты расчетов для других ШГК приведены в таблице.

Во всех изучаемых кристаллах, за исключением LiF, частоты внутримолекулярных колебаний X_2^- лежат выше максимальной частоты колебаний решетки идеального кристалла, и все эти колебания являются локальными. В кристалле LiF колебание на частоте 455 см^{-1} является резонансным. Наряду с высокочастотными колебаниями выделены низкочастотные резонансные колебания, а также щелевое колебание для кристалла KI (90 см^{-1}).

В таблице приведены экспериментальные значения частот локальных колебаний Vk -центров, полученные измерением спектров комбинационного рассеяния [5], а также расчетные данные [6,7].

Наблюдается хорошее совпадение наших результатов расчета высокочастотных колебаний Vk -центров с экспериментом, а также с результатами расчетов [6]. Имеется отличие в числе локальных колебаний для всех кристаллов (кроме KCl) в наших расчетах и в расчете, проведенном методом суперячейки.



ЛПС в позиции катиона для направления x в кристалле RbCl.
 Сплошная линия — ЛПС в идеальном кристалле (ρ_0), штриховая линия — приращение ЛПС $\Delta\rho = \rho - \rho_0$ в кристалле с Vk -центром. ω_L — частота локального колебания (245 см^{-1}).

Частоты колебаний (см^{-1}) для Vk -центра в ШГК

Кристалл	Расчет			Эксперимент [5]	Максимальная частота для идеального кристалла
	васт. раб.	[6]	[7]		
LiF	455	449	494	437 ± 2	665
	740				
NaF	486	120	560	-	414
	530				
	120	107			
KCl	245	238	288	241 ± 2	210
	295				
	53	54			
RbCl	245	241	284	244 ± 2	173
	52	49			
KI	90 (щ)	101	-	-	138
	180				
	22	32			

Примечание. щ — щелевое колебание.

На примере кристалла KI с U -центрами рассмотрена возможность использования рекурсивного метода для расчета локальных колебаний в модели оболочек.

Построение динамической матрицы в модели оболочек в реальном пространстве описано в работе [8]. Для выделения частот локальных колебаний, индуцируемых U -центрами в KI, рассчитывали симметризованные ЛПС в идеальном и дефектном кристаллах [9].

С использованием параметров взаимодействий ионов $H^- - K^+$ и $H^- - I^-$ [10] по описанной выше методике нами рассчитаны частоты локальных и щелевых колебаний в KI(H^-). Вычисления дают локальное колебание симметрии T_{1u} с частотой 396.0 см^{-1} и щелевое полносимметричное колебание A_{1g} с частотой 99.4 см^{-1} . Экспериментальные значения этих частот равны 387.0 см^{-1} [11] и 95.1 см^{-1} [12] соответственно.

Таким образом, хорошее согласие между результатами нашего расчета и экспериментом показывает эффективность использования рекурсивного метода для определения частот локальных колебаний заряженных и незаряженных дефектов, а также корректность используемых моделей центров. К сожалению, в настоящий момент для ШГК не имеется экспериментальных данных по низкочастотным модам Vk -центров. Поэтому мы не имеем возможности оценить для них адекватность полученных результатов по низкочастотным резонансам.

Список литературы

- [1] Мазуренко В.Г. // ФТТ. 1990. Т. 32. № 11. С. 3399–3404.
- [2] Мазуренко В.Г., Кортон В.С. // ФТТ. 1990. Т. 32. № 10. С. 3034–3037.
- [3] Boyer L.L. // Phys. Rev. B. 1981. V. 23. N 8. P. 3673–3685.
- [4] Daly D.F., Miehler R.L. // Phys. Rev. 1969. V. 183. P. 368–383.
- [5] Goovaerts E., Schoemaker D. // Phys. Stat. Solidi (b). 1978. V. 88. P. 615–619.
- [6] Harding J.H. // J. Phys. C. 1980. V. 13. P. 3505–3510.
- [7] Jette A.N., Gilbert T.L., Das T.P. // Phys. Rev. 1969. V. 184. P. 884–896.
- [8] Мазуренко В.Г., Кислов А.Н. // ФТТ. 1991. Т. 33. № 4. С. 1220–1225.
- [9] Мазуренко В.Г., Кислов А.Н. // ФТТ. 1992. Т. 34. № 11. С. 3403–3408.
- [10] Hassain A.R., Sangster M.J.L. // J. Phys. C. 1986. V. 19. N 19. P. 3535–3547.
- [11] Schlaeger G. // J. Phys. Chem. Sol. 1960. V. 12. N 314. P. 233–244.
- [12] Gethins T., Timusk T., Woll E.J. // Phys. Rev. 1967. V. 157. N 3. P. 744–750.

Уральский государственный
технический университет
Екатеринбург

Поступило в Редакцию
7 апреля 1993 г.